

**NEWS RELEASE****米国で行われた SWTest2025 において、  
ヨコオ初の Best Poster Presentation 賞を受賞****Best Poster Presentation 賞の受賞トロフィー****展示を行った光電融合プローブカード**

株式会社ヨコオ(本社:東京都千代田区、社長:徳間孝之)は、このたび、米国カリフォルニア州カールスバッドで行われた SWTest2025 において、技術ポスター発表を行い、ヨコオとして初めて「**Best Poster Presentation 賞**」を受賞したことを発表いたします。

SWTest (Semiconductor Wafer Test Conference)は、半導体ウエハーおよびダイレベルのテスト技術に特化した世界で唯一の専門国際会議です。1990 年代から毎年開催され、2025 年は 6 月 1 日～4 日の日程で米国カリフォルニア州カールスバッドの Omni La Costa Resort & Spa in Carlsbad で行われました。

この国際会議は、最新のプローブカード、プローブ装置、および関連サービスを提供するトップサプライヤーが集まり、最新の技術開発について業界のリーダーと意見交換が行われる場になっており、このような場で「Best Poster Presentation 賞」を受賞したことは大変名誉なことです。

現代の社会活動において、AI 技術応用をはじめ膨大なデジタルデータ処理が必要になり、今や半導体デバイスにおける信号伝送の高速化、低消費電力化に対応するには、従来の電気信号処理技術だけではなく光信号処理技術を適用することが必須となってきています。

そのような中、今回ヨコオは、従来の製品技術に、新たに多チャンネルの光ファイバーアレイを組み込むことで、ウエハーレベルにおけるシリコンフォトリソグラフィ検査に対応できる光電融合プローブカードを展示し、技術ポスター発表を行いました。

ヨコオは今後も、長い歴史で培ってきたコア技術を生かし、社会ニーズのその先を見据えた技術開発を行い、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

(注) ニュースリリースに記載されている内容は報道発表日時点の情報です。その後、予告なしに変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。

◇ 本件に関するお問い合わせ先  
株式会社ヨコオ 広報部 松本  
TEL: 03-3916-3179 携帯: 080-2275-3255  
E-mail: [h-matsumoto@jp.yokowo.com](mailto:h-matsumoto@jp.yokowo.com)